

Akkreditierung



Die Deutsche Akkreditierungsstelle bestätigt mit dieser **Akkreditierungsurkunde**, dass das Kalibrierlaboratorium

JENOPTIK Industrial Metrology Germany GmbH
Drachenloch 5, 78052 Villingen-Schwenningen

die Anforderungen gemäß DIN EN ISO/IEC 17025:2018 für die in der Anlage zu dieser Urkunde aufgeführten Konformitätsbewertungstätigkeiten erfüllt. Dies schließt zusätzliche bestehende gesetzliche und normative Anforderungen an das Kalibrierlaboratorium ein, einschließlich solcher in relevanten sektoralen Programmen, sofern diese in der Anlage zu dieser Urkunde ausdrücklich bestätigt werden.

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer für Kalibrierlaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Übereinstimmung mit den Prinzipien der DIN EN ISO 9001.

Diese Akkreditierung wurde gemäß Art. 5 Abs. 1 Satz 2 VO (EG) 765/2008, nach Durchführung eines Akkreditierungsverfahrens unter Beachtung der Mindestanforderungen der DIN EN ISO/IEC 17011 und auf Grundlage einer Bewertung und Entscheidung durch den eingesetzten Akkreditierungsausschuss ausgestellt.

Diese Akkreditierungsurkunde gilt nur in Verbindung mit dem Bescheid vom 17.03.2025 mit der Akkreditierungsnummer D-K-15030-01.

Sie besteht aus diesem Deckblatt, der Rückseite des Deckblatts und der folgenden Anlage mit insgesamt 6 Seiten.

Registrierungsnummer der Akkreditierungsurkunde: **D-K-15030-01-00**

Berlin, 17.03.2025

Im Auftrag Dr. Florian Witt
Fachbereichsleitung

Diese Urkunde gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand der gültigen und überwachten Akkreditierung ist der Datenbank akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle zu entnehmen (www.dakks.de).

Deutsche Akkreditierungsstelle

Standort Berlin
Spittelmarkt 10
10117 Berlin

Standort Frankfurt am Main
Europa-Allee 52
60327 Frankfurt am Main

Standort Braunschweig
Bundesallee 100
38116 Braunschweig

Die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS) ist die beliehene nationale Akkreditierungsstelle der Bundesrepublik Deutschland gemäß § 8 Absatz 1 AkkStelleG i. V. m. § 1 Absatz 1 AkkStelleGBV. Die DAkkS ist als nationale Akkreditierungsbehörde gemäß Art. 4 Abs. 4 VO (EG) 765/2008 und Tz. 4.7 DIN EN ISO/IEC 17000 durch Deutschland benannt.

Die Akkreditierungsurkunde ist gemäß Art. 11 Abs. 2 VO (EG) 765/2008 im Geltungsbereich dieser Verordnung von den nationalen Behörden als gleichwertig anzuerkennen sowie von den WTO-Mitgliedsstaaten, die sich in bilateralen- oder multilateralen Gegenseitigkeitsabkommen verpflichtet haben, die Urkunden von Akkreditierungsstellen, die Mitglied bei ILAC oder IAF sind, als gleichwertig anzuerkennen.

Die DAkkS ist Unterzeichnerin der Multilateralen Abkommen zur gegenseitigen Anerkennung der European co-operation for Accreditation (EA), des International Accreditation Forum (IAF) und der International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC).

Der aktuelle Stand der Mitgliedschaft kann folgenden Webseiten entnommen werden:

EA: www.european-accreditation.org

ILAC: www.ilac.org

IAF: www.iaf.nu

Deutsche Akkreditierungsstelle

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15030-01-00 nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018

Gültig ab: 17.03.2025

Ausstellungsdatum: 17.03.2025

Inhaber der Akkreditierungsurkunde:

JENOPTIK Industrial Metrology Germany GmbH
Drachenloch 5, 78052 Villingen-Schwenningen

mit dem Standort

JENOPTIK Industrial Metrology Germany GmbH
Drachenloch 5, 78052 Villingen-Schwenningen

Das Kalibrierlaboratorium erfüllt die Anforderungen gemäß DIN EN ISO/IEC 17025:2018, um die in dieser Anlage aufgeführten Konformitätsbewertungstätigkeiten durchzuführen. Das Kalibrierlaboratorium erfüllt gegebenenfalls zusätzliche gesetzliche und normative Anforderungen, einschließlich solcher in relevanten sektoralen Programmen, sofern diese nachfolgend ausdrücklich bestätigt werden.

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer für Kalibrierlaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Übereinstimmung mit den Prinzipien der DIN EN ISO 9001.

Diese Urkundenanlage gilt nur zusammen mit der schriftlich erteilten Urkunde und gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand der gültigen und überwachten Akkreditierung ist der Datenbank akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle zu entnehmen (www.dakks.de)

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15030-01-00

Kalibrierungen in den Bereichen:

Dimensionelle Messgrößen

Länge

- **Rauheit**
- **Formabweichung**
- **Kontur**
- **Tastschnittgeräte ^{a)}**
- **Längenmessgeräte ^{a)}**

a) auch Vor-Ort-Kalibrierung

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15030-01-00

Permanentes Laboratorium

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Länge Rillentiefe <i>Pt</i> und <i>d</i> auf Tiefeneinstell- normalen	0,15 µm bis 12 µm > 12 µm bis 5500 µm	DIN EN ISO 4287:2010 DIN EN ISO 5436-1:2000 DIN EN ISO 3274:1998 DIN EN ISO 21920-2: 2022 DIN EN ISO 21920-3: 2022	0,012 µm + 0,8 · 10 ⁻³ · <i>Pt</i> 0,012 µm + 0,8 · 10 ⁻³ · <i>d</i> 0,022 µm + 0,036 · 10 ⁻³ · <i>Pt</i> 0,022 µm + 0,036 · 10 ⁻³ · <i>d</i>	
Rauheit auf Geometrienormalen <i>Ra</i> <i>Rz</i> <i>Rmax, RzImax</i> <i>Rzx(l)</i> <i>RSm</i>	0,1 µm bis 3,5 µm 0,5 µm bis 20 µm 0,5 µm bis 20 µm 0,5 µm bis 20 µm 40 µm bis 400 µm	DIN 4768:1990 DIN EN ISO 3274:1998 DIN EN ISO 4287:2010 DIN EN ISO 4288:1998 DIN EN ISO 16610-21: 2013 DIN EN ISO 21920-2: 2022 DIN EN ISO 21920-3: 2022	1,5 % · <i>Ra</i> 1,5 % · <i>Rz</i> 2,0 % · <i>Rmax</i> 2,0 % · <i>RzImax</i> 2,0 % · <i>Rzx(l)</i> 1,5 µm	Im Bedarfsfall darf die Filtergrenzwellenlänge λ_c eine Stufe kleiner oder bis zu zwei Stufen größer als nach Norm verwendet werden, jedoch nicht größer als $\lambda_c = 2,5$ mm
<i>Ra</i> <i>Rz</i> <i>RPc</i> <i>Rpc</i>	0,1 µm bis 3,5 µm 0,5 µm bis 20 µm 25 ≤ <i>RPc</i> ≤ 150 25 ≤ <i>Rpc</i> ≤ 150	Stahl-Eisen-Prüfblatt (SEP) 1940:2002 DIN EN 10049:2014 DIN EN ISO 21920-2: 2022 DIN EN ISO 21920-3: 2022	5,0 % · <i>Ra</i> 5,0 % · <i>Rz</i> 2,0 cm ⁻¹ 2,0 cm ⁻¹	je nach Profilhöhe dürfen auch andere Schnittlinienabstände (wie vorgegeben) gewählt werden
Rauheit auf aperiоди- schen Raunormalen <i>Ra</i> <i>Rz</i> <i>Rmax, RzImax</i> <i>Rzx(l)</i>	0,1 µm bis 3,5 µm 0,5 µm bis 20 µm 0,5 µm bis 20 µm 0,5 µm bis 20 µm	DIN 4768:1990 DIN EN ISO 3274:1998 DIN EN ISO 4287:2010 DIN EN ISO 4288:1998 DIN EN ISO 16610-21: 2013 DIN EN ISO 21920-2: 2022 DIN EN ISO 21920-3: 2022	2,5 % · <i>Ra</i> 3,0 % · <i>Rz</i> 3,5 % · <i>Rmax</i> 3,5 % · <i>RzImax</i> 3,5 % · <i>Rzx(l)</i>	
<i>Rpk</i> <i>Rk</i> <i>Rvk</i>	auf Oberflächen im Bereich	DIN 4776:1990 DIN EN ISO 13565-1:1998 DIN EN ISO 13565-2:1998	9,0 % · <i>Rpk</i> 5,0 % · <i>Rk</i> 8,0 % · <i>Rvk</i>	
<i>Mr1, Rmr1</i> <i>Mr2, Rmr2</i>	0,1 µm ≤ <i>Ra</i> ≤ 3,5 µm 0,5 µm ≤ <i>Rz</i> ≤ 20 µm	DIN EN ISO 21920-2: 2022 DIN EN ISO 21920-3: 2022 DIN EN ISO 16610-31:2017	2,0 % 2,0 %	Rel. Messunsicherheit bezogen auf 100 % Materialanteil
<i>Ra</i> <i>Rz</i> <i>RPc</i> <i>Rpc</i>	0,1 µm bis 3,5 µm 0,5 µm bis 20 µm 25 ≤ <i>RPc</i> ≤ 100 25 ≤ <i>Rpc</i> ≤ 100	Stahl-Eisen-Prüfblatt (SEP) 1940:2002 DIN EN 10049:2014 DIN EN ISO 21920-2: 2022 DIN EN ISO 21920-3: 2022	8 % · <i>Ra</i> 8 % · <i>Rz</i> 2,0 cm ⁻¹ 2,0 cm ⁻¹	je nach Profilhöhe dürfen auch andere Schnittlinienabstände (wie vorgegeben) gewählt werden

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15030-01-00

Permanentes Laboratorium

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Rauheit auf aperiodischen superfeinen Raunormalen <i>Ra</i> <i>Rz</i> <i>Rmax, RzImax</i> <i>Rzx(l)</i>	0,015 µm bis 0,1 µm 0,1 µm bis 0,8 µm 0,1 µm bis 0,8 µm 0,1 µm bis 0,8 µm	DIN 4768:1990 DIN EN ISO 3274:1998 DIN EN ISO 4287:2010 DIN EN ISO 4288:1998 DIN EN ISO 16610-21: 2013 DIN EN ISO 21920-2: 2022 DIN EN ISO 21920-3: 2022	6 % · <i>Ra</i> 7 % · <i>Rz</i> 9 % · <i>Rmax</i> 9 % · <i>Rzx(l)</i>	
<i>Rpk</i> <i>Rk</i> <i>Rvk</i>	auf Oberflächen im Bereich	DIN 4776:1990 DIN EN ISO 13565-1:1998 DIN EN ISO 13565-2:1998	10 % · <i>Rpk</i> 6 % · <i>Rk</i> 9 % · <i>Rvk</i>	
<i>Mr1, Rmr1</i> <i>Mr2, Rmr2</i>	0,015 µm ≤ <i>Ra</i> ≤ 0,1 µm 0,1 µm ≤ <i>Rz</i> ≤ 0,8 µm	DIN EN ISO 21920-2: 2022 DIN EN ISO 21920-3: 2022 DIN EN ISO 16610-31:2017	2,0 % 2,0 %	Rel. Messunsicherheit bezogen auf 100 % Materialanteil
Rundheitsverkörperungen Rundheitsabweichung	bis 10 µm > 10 µm bis 20 µm	DIN EN ISO 1101:2017 DIN EN ISO 12181-1:2011 DIN EN ISO 12181-1:2011 DKD-R 4-4:2018	0,025 µm 0,1 µm	Durchmesser: 5 mm bis 300 mm
Vergrößerungsnormale (engl.: flick standards) Rundheitsabweichung	2 µm bis 20 µm > 20 µm bis 60 µm > 60 µm bis 500 µm		0,2 µm 0,3 µm 0,5 % vom Messwert	
Zylindrische Formverkörperungen Rundheitsabweichung	bis 20 µm	DIN EN ISO 1101:2017 DIN EN ISO 12181-1:2011 DIN EN ISO 12181-1:2011 DKD-R 4-4:2018	0,1 µm	Durchmesser: 3 mm bis 300 mm Länge: 5 mm bis 300 mm
Geradheitsabweichung der Mantellinie Länge: 2 mm bis 300 mm	bis 10 µm		0,2 µm	
Länge: 2 mm bis 100 mm	> 10 µm bis 20 µm		0,2 µm	
Länge: > 100 mm bis 300 mm			0,3 µm	
Parallelitätsabweichung der Mantellinie Länge: 2 mm bis 300 mm	bis 10 µm		0,3 µm	
Länge: 2 mm bis 100 mm	> 10 µm bis 20 µm		0,3 µm	
Länge: > 100 mm bis 300 mm			0,4 µm	

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15030-01-00

Permanentes Laboratorium

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Konturnormale Länge X Laterale Abstände	5 mm bis 100 mm	Substitutionsmessung mit Bezugskonturnormal nach VDI/VDE 2629 Blatt 1: 2008 Verfahren nach DIN EN ISO 15530-3:2012	0,6 µm	
Länge Z Vertikale Abstände	bis 10 mm		0,75 µm	
Radien	2 mm bis 12 mm		0,75 µm	
Winkel	40° bis 135°		0,01°	
Tastschnittgeräte nach DIN 4772:1979 DIN EN ISO 3274:1998 Rillentiefe <i>Pt</i> und <i>d</i> <i>Ra</i> <i>Rz</i> <i>Rmax</i> , <i>RzImax</i> <i>Rzx(l)</i> <i>RSm</i>	0,15 µm bis 5500 µm 0,015 µm bis 3,5 µm 0,1 µm bis 20 µm 0,1 µm bis 20 µm 0,1 µm bis 20 µm 40 µm bis 400 µm	DKD-R 4-2 Blatt 2:2018 DIN EN ISO 12179:2020 E DIN 4768: 1990 DIN EN ISO 3274: 1998 DIN EN ISO 4287: 2010 DIN EN ISO 4288: 1998 DIN EN ISO 16610-21:2013 DIN EN ISO 21920-2: 2022 DIN EN ISO 21920-3: 2022	$U_{\text{normal}} + 0,01 \mu\text{m}$ $U_{\text{normal}} + 1\% \cdot Ra$ $U_{\text{normal}} + 1\% \cdot Rz$ $U_{\text{normal}} + 1\% \cdot Rmax$ $U_{\text{normal}} + 1\% \cdot Rzx(l)$ $U_{\text{normal}} + 1 \mu\text{m}$	U_{normal} ist die Messunsicherheit der verwendeten Normale Es können auch kleinere Messbereiche kalibriert werden, für die Normale vorliegen
<i>Rpk</i> <i>Rk</i> <i>Rvk</i>	auf Oberflächen im Bereich	DIN 4776: 1990 DIN EN ISO 13565-1: 1998 DIN EN ISO 13565-2: 1998	$U_{\text{normal}} + 1\% \cdot Rpk$ $U_{\text{normal}} + 1\% \cdot Rk$ $U_{\text{normal}} + 1\% \cdot Rvk$	
<i>Mr1</i> , <i>Rmr1</i> <i>Mr2</i> , <i>Rmr2</i>	$0,015 \mu\text{m} \leq Ra \leq 3,5 \mu\text{m}$ $0,1 \mu\text{m} \leq Rz \leq 20 \mu\text{m}$	DIN EN ISO 21920-2: 2022 DIN EN ISO 21920-3: 2022 DIN EN ISO 16610-31:2017	$U_{\text{normal}} + 1\%$ $U_{\text{normal}} + 1\%$	Relative Messunsicherheit bezogen auf 100 % Materialanteil
Optoelektronische Längen- und Durchmesser- messmessgeräte (Wellenmessgeräte)		Schattenbildverfahren QMV: Kalibrierung von Wellenmessgeräten: 2024-12		Es können auch kleinere Messbereiche kalibriert werden, für die Normale vorliegen
Durchmesser	bis 320 mm		$0,4 \mu\text{m} + 0,6 \cdot 10^{-6} \cdot d$	<i>d</i> = gemessener Durchmesser
Länge	bis 1200 mm		$0,5 \mu\text{m} + 0,6 \cdot 10^{-6} \cdot l$	<i>l</i> = gemessene Länge

Vor-Ort-Kalibrierung

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Tastschnittgeräte nach DIN 4772:1979 DIN EN ISO 3274:1998 Rillentiefe P_t und d R_a R_z R_{max} , R_{z1max} $R_{zx}(l)$ RS_m	0,15 μm bis 5500 μm 0,015 μm bis 3,5 μm 0,1 μm bis 20 μm 0,1 μm bis 20 μm 0,1 μm bis 20 μm 40 μm bis 400 μm	DKD-R 4-2 Blatt 2:2018 DIN EN ISO 12179:2020 E DIN 4768: 1990 DIN EN ISO 3274: 1998 DIN EN ISO 4287: 2010 DIN EN ISO 4288: 1998 DIN EN ISO 16610-21:2013 DIN EN ISO 21920-2: 2022 DIN EN ISO 21920-3: 2022	$U_{\text{normal}} + 0,01 \mu\text{m}$ $U_{\text{normal}} + 1 \% \cdot R_a$ $U_{\text{normal}} + 1 \% \cdot R_z$ $U_{\text{normal}} + 1 \% \cdot R_{max}$ $U_{\text{normal}} + 1 \% \cdot R_{zx}(l)$ $U_{\text{normal}} + 1 \mu\text{m}$	U_{normal} ist die Messunsicherheit der verwendeten Normale Es können auch kleinere Messbereiche kalibriert werden, für die Normale vorliegen
R_{pk} R_k R_{vk}	auf Oberflächen im Bereich	DIN 4776: 1990 DIN EN ISO 13565-1: 1998 DIN EN ISO 13565-2: 1998	$U_{\text{normal}} + 1 \% \cdot R_{pk}$ $U_{\text{normal}} + 1 \% \cdot R_k$ $U_{\text{normal}} + 1 \% \cdot R_{vk}$	
$Mr1$, $Rmr1$ $Mr2$, $Rmr2$	$0,015 \mu\text{m} \leq R_a \leq 3,5 \mu\text{m}$ $0,1 \mu\text{m} \leq R_z \leq 20 \mu\text{m}$	DIN EN ISO 21920-2: 2022 DIN EN ISO 21920-3: 2022 DIN EN ISO 16610-31:2017	$U_{\text{normal}} + 1 \%$ $U_{\text{normal}} + 1 \%$	Relative Messunsicherheit bezogen auf 100 % Materialanteil
Optoelektronische Längen- und Durchmessermessgeräte (Wellenmessgeräte)		Schattenbildverfahren QMV: Kalibrierung von Wellenmessgeräten: 2024-12		Es können auch kleinere Messbereiche kalibriert werden, für die Normale vorliegen
Durchmesser	bis 320 mm		$0,4 \mu\text{m} + 0,6 \cdot 10^{-6} \cdot d$	d = gemessener Durchmesser
Länge	bis 1200 mm		$0,5 \mu\text{m} + 0,6 \cdot 10^{-6} \cdot l$	l = gemessene Länge

Verwendete Abkürzungen:

CMC	Calibration and measurement capabilities (Kalibrier- und Messmöglichkeiten)
DIN	Deutsches Institut für Normung e.V.
DKD-R	Richtlinie des Deutschen Kalibrierdienstes (DKD), herausgegeben von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt
EN	Europäische Norm
ISO	Internationale Organisation für Normung
VDI	Verein Deutscher Ingenieure e.V.
VDE	Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik e.V.
QMA	Hausverfahren der JENOPTIK Industrial Metrology Germany GmbH